

## Оборудование для литологического анализа

[AXIO IMAGER Система имидж-анализа](#)

[AXIO SCOPE.A1 Поляризационный микроскоп](#)

[AXIOVISION Программное обеспечение](#)

[VJ 12 Устройство прижима с подогревом](#)

[CS 200 Ручной отрезной станок](#)

[GADIS Система для исследования изотермической адсорбции газа](#)

[GTS 1 Отрезной станок](#)

[IU-30 Аппарат для вакуумной пропитки образцов](#)

[LGP 250 Ручной станок для шлифовки и по](#)

[LP 50 Автоматический станок для шлифовки петрографических шлифов](#)

[OMP 700 Ртутный порозиметр для исследования при пластовых давлениях](#)

[PM5 Станок для полировки петрографических шлифов](#)

[SG 200 Станок для резки и шлифовки](#)

[SGL 200 Станок для резки, шлифовки, полировки](#)

[STEMI-2000 Стереомикроскоп](#)

[STEREO DISCOVERY V.12 Стереомикроскоп](#)

[Thixomet PRO Программное обеспечение](#)

[UVP-10/75 Бокс для исследования керна в УФ -свете](#)

[VEU Аппарат для вакуумной пропитки образцов](#)

[< TST 700 Лабораторный комплекс для исследования прочностных характеристик пород](#)  
[Вверх AXIO IMAGER Система имидж-анализа >](#)

**Источник:** <http://vinci-technologies.ru/node/420>